

## Cu-W 复合电沉积工艺研究

洪逸<sup>1</sup>, 张晓燕<sup>1,2</sup>, 李广宇<sup>1</sup>, 马小东<sup>1</sup>, 敖启艳<sup>1</sup>

(1. 贵州大学材料科学与冶金工程学院, 贵州 贵阳 550003; 2. 贵州省材料结构与强度重点实验室, 贵州 贵阳 550003)

**[摘要]** 电接触材料要求具有很好的抗电弧烧蚀和抗熔焊性能, 但纯铜很难达到该种要求。利用复合电沉积方法, 在纯铜表面形成 Cu-W 复合镀层, 使其满足电触头材料的使用性能。重点研究了镀液中 W 的质量浓度、电流密度、搅拌强度和温度工艺参数对 Cu-W 电接触材料复合镀层中 W 微粒沉积量的影响, 并且通过正交试验确定了复合电沉积的最优工艺: W 的质量浓度为 35g/L、电流密度为 4A/dm<sup>2</sup>、搅拌强度为 600r/min、温度为 50℃。

**[关键词]** 复合电沉积; 复合镀层; 工艺参数; 电接触材料; 铜钨合金

[中图分类号] TQ153.2; TB333

[文献标识码] A

[文章编号] 1001-3660(2008)05-0064-02

## Study on Cu-W Composite Electroplating Process

HONG Yi<sup>1</sup>, ZHANG Xiao-yan<sup>1,2</sup>, LI Guang-yu<sup>1</sup>, MA Xiao-dong<sup>1</sup>, AO Qi-yan<sup>1</sup>

(1. School of Materials Science and Metallurgical Engineering, Guizhou University, Guiyang 550003, China;

2. Guizhou Key Laboratory for Mechanical Behavior and Microstructure of Materials,

Guizhou University, Guiyang 550003, China)

**[Abstract]** Contact materials are demanded to have finer electric erosion resistance and anti-welding properties, but pure copper can't meet the requirement easily. The Cu-W composite deposits was formed on the surface of pure copper by composite electro deposition, to meet the service performance of contact material. The influence of W particulate content in Cu-W composite deposits including W mass concentration, current density, stirring intention and temperature on W particulate content in Cu-W composite deposits was laid special stress on, and the optimum process parameters for composite electrodeposition were determined by orthogonal experimentations. And the optimal process: W mass concentration 35 g/L, current density 4A/dm<sup>2</sup>, stirring intention 600 r/min, the temperature of 500℃.

**[Key words]** Composite electrodeposition; Composite deposits; Process parameter; Electrical contact material; Cu-W alloy

## 0 引言

所谓复合电沉积,就是在电镀或化学镀溶液中加入非水溶性的固体微粒,并使其与主体金属共沉积在基材上的涂覆工艺,得到的镀层为复合镀层<sup>[1]</sup>。目前,电沉积复合镀层在自润滑性能、电接触材料以及在电催化、光活性材料、储能等领域得到了开发和应用<sup>[2]</sup>。

电接触材料,也称之为接触元件,是高、低电器开关仪器仪表中的重要元器件,它担负着电路间接通与断开,同时负载相应电路中电流的任务。在现代化大型电气系统中,如大型电力系统、自动化系统、通讯系统中包括了数以万计的电接触元件。随着航空、电子、机械、海洋、化工、冶金及核能等工业的开发和进展,对电接触元件触头的工作寿命和工作可靠性提出了愈来愈高的要求<sup>[3-4]</sup>。本文研究了复合电沉积工艺参数对铜表面沉积 Cu-W 电接触材料复合镀层的影响。

[收稿日期] 2008-07-07

[基金项目] 贵州大学大学生创新性实验计划项目(2007-004)

[作者简介] 洪逸(1987-),男,浙江台州人,本科,研究方向为电接触材料的耐蚀性能。

## 1 试验器材和条件

试验镀液的组成如下:125~160g/L CuSO<sub>4</sub>·5H<sub>2</sub>O、30g/L CuCl<sub>2</sub>、70~80mL/L H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>、固体颗粒含量为20~40g/L, 固体颗粒粒径为1~3μm, 温度为20~60℃, 电流密度为2~4A/dm<sup>2</sup>, 机械搅拌速度为400~800r/min, 电镀时间为120min。

镀件在进行复合电沉积前,要进行机械磨光、水洗、化学抛光、丙酮擦拭、超声波除油、弱侵蚀。在进行复合电沉积之前,电解液要利用机械搅拌和超声波辅助对镀液进行充分搅拌,时间15~30min,以保证微粒充分均匀地悬浮于镀液中。阳极为纯铜板20mm×10mm, 纯度≥99.5%; 阴极镀件为紫铜片10mm×10mm。W粉根据GB3458-1982选择FW-2,用MPS-2000R型颗粒度测试仪测定固体颗粒粒度,平均粒径为1~3μm。复合电沉积后镀件经防变色处理。

镀层中微粒的含量采用质量分析法,将复合镀层置于适量硝酸中进行溶解,待镀层全部溶解完毕,用清水稀释。然后用烘干且称过质量的定量滤纸过滤稀释液,待其过滤后,用清水清洗数遍、烘干、称重。定量滤纸2次质量的差值为镀层中微粒含量。

## 2 试验结果和讨论

### 2.1 单因素试验

#### 2.1.1 镀液中W质量浓度的影响

图1是在温度为30℃、搅拌器转速为500r/min和电流密度为3A/dm<sup>2</sup>的条件下,当镀液中W的质量浓度变化时,镀层中W沉积量的试验结果。由图1可知,W的沉积量随着它在镀液中质量浓度的增大而增加。

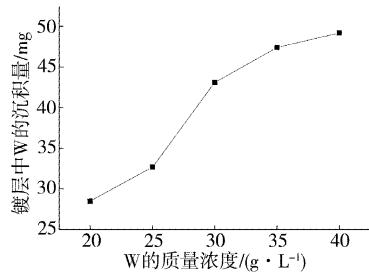


图1 W质量浓度与W沉积量的关系

Figure 1 Relationship between W mass concentration and the W content in deposit

#### 2.1.2 电流密度的影响

图2是在温度为30℃、搅拌器转速为500r/min、镀液中W的质量浓度为30g/L的条件下,当阴极电流密度变化时,镀层中W沉积量的试验结果。由图2可知,W沉积量随着阴极电流密度的增大而增加,当电流密度达到3.5A/dm<sup>2</sup>时,镀层中W沉积量达到极限值。

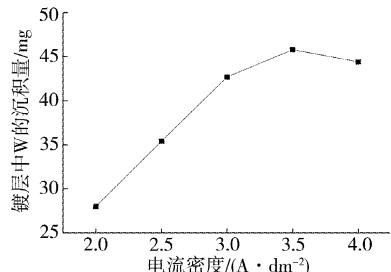


图2 电流密度与W沉积量关系图

Figure 2 Relationship between current density and the W content in deposit

#### 2.1.3 搅拌强度的影响

图3是在温度为30℃、电流密度为3A/dm<sup>2</sup>、镀液中W的质量浓度为30g/L的条件下,当搅拌强度变化时,镀层中W沉积量的试验结果。由图3可知,镀层中W的沉积量随着搅拌强度的增强而逐渐增大,并且沉积量先增至极限值,再逐渐降低。

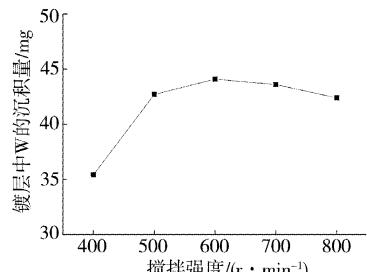


图3 搅拌强度与W沉积量关系图

Figure 3 Relationship between stirring intention and the W content in deposit

#### 2.1.4 温度的影响

图4是电流密度为3A/dm<sup>2</sup>、搅拌器转速为500r/min、镀液中W的质量浓度为30g/L的条件下,当温度变化时,镀层中W沉积量的试验结果。由图4可知,随着温度升高,沉积量缓慢升高,温度在30~50℃时镀层中W的沉积量趋于稳定,50℃以后开始降低。

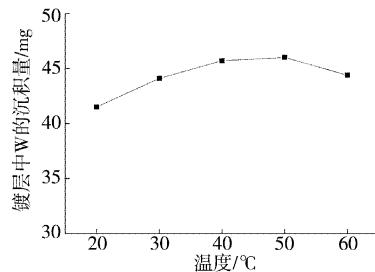


图4 温度与W沉积量关系图

Figure 4 Relationship between temperature and the W content in deposit

## 2.2 正交试验

#### 2.2.1 正交试验方案和结果

由单因素试验结果可知,复合镀层中W的沉积量受镀液中W的质量浓度、电流密度、搅拌强度和温度因素影响。故正交试验采用4因素3水平的方案(见表1),正交表选用L<sub>9</sub>(3<sup>4</sup>)进行试验。

表1 因素水平表

Table 1 Factor level form

水平	因 素			
	W质量浓度 / (g·L⁻¹)	电流密度 / (A·dm⁻²)	搅拌强度 / (r·min⁻¹)	温度 / °C
1	25	3	500	30
2	30	3.5	600	40
3	35	4	700	50

#### 2.2.2 极差分析

将正交试验所得的数据进行极差分析,如表2所示,检验各因素的显著性。检验结果表明,镀液中W的质量浓度和电流密度对复合镀层中W含量影响显著,搅拌强度和温度影响其次。最优的工艺为:W的质量浓度35g/L、电流密度4A/dm<sup>2</sup>、搅拌强

表2 极差分析数据表

Table 2 Range analysis data sheet

试验号	W的质量浓度	电流密度	搅拌强度	温度	镀层中微粒沉积量 / mg
1	1	1	1	1	33.4
2	1	2	2	2	44.8
3	1	3	3	3	49.3
4	2	1	2	3	48.9
5	2	2	3	1	50.2
6	2	3	1	2	50.8
7	3	1	3	2	49.4
8	3	2	1	3	51.1
9	3	3	2	1	51.6
$K_{1j}$	127.5	131.7	135.3	135.2	
$K_{2j}$	149.9	146.1	149.3	145	
$K_{3j}$	152.1	151.7	144.9	149.3	
$R_j$	24.6	20	14	14.1	

(下转第84页)

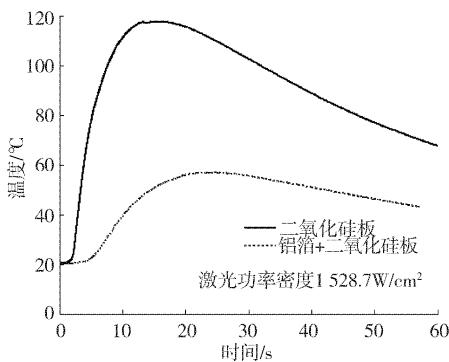
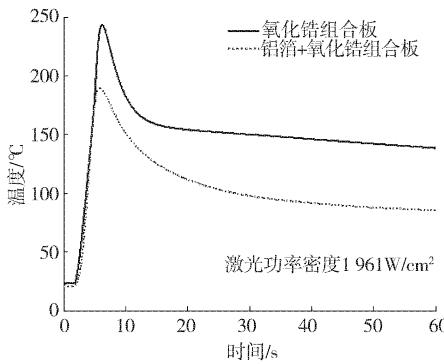
图4 SiO<sub>2</sub>纤维复合板试验温度曲线Figure 4 The temperature of SiO<sub>2</sub> fiber ply

图5 氧化锆金属板试验温度曲线

Figure 5 The temperature of the metal based zirconia ply

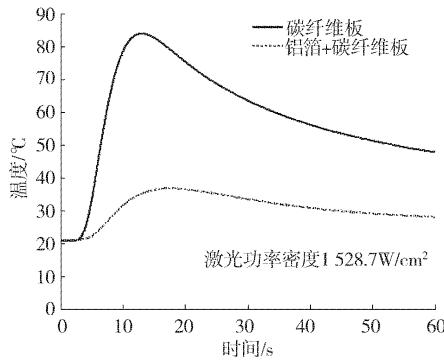


图6 碳纤维板试验温度曲线

Figure 6 The temperature of carbon fiber ply

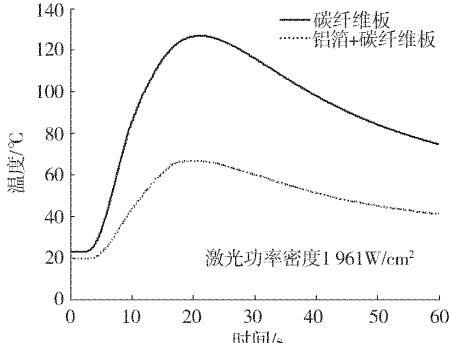


图7 改变激光功率碳纤维板试验温度曲线

Figure 7 The temperature of carbon fiber ply  
when the power of laser was changed

表2 有反射层和无反射层试件试验结果对比  
Table 2 The result comparison of the reflecting layer and no reflecting layer sample

试件状态	功率密度 / (W · cm <sup>-2</sup> )	出光时间/s	最高温度 / °C	质量损失/g
SiO <sub>2</sub> 纤维复合板	1 528.7	1	112	0.065 3
SiO <sub>2</sub> 纤维复合板 + 铝箔			57	0.016 9
碳纤维/环氧	1 528.7	1	84	0.737 4
碳纤维/环氧 + 铝箔			35	0.013 2
碳纤维/环氧	1 961	3	127	0.081 8
碳纤维/环氧 + 铝箔			67	0.033 9

## 4 结 论

通过设计反射层激光防护性能试验,选取铝箔作为高反射层来研究反射层对材料抗激光防护的作用。在试验中从2个角度出发:基材材料不同,反射防护性能;激光参数不同,基材材料相同反射防护性能,通过分析粘贴反射层和无反射层试件的试验结果,认为反射层起到了将激光能量部分反射出去的作用,降低了底部基材的热效应,达到了防护作用。

### [参考文献]

- [1] 孟献丰,陆春华. 激光技术的应用与防护[J]. 红外与激光工程, 2005, 34(2): 136-141
- [2] 孙承伟. 激光辐照效应[M]. 北京: 国防工业出版社, 2002. 6-27
- [3] 陆建. 高功率激光与材料相互作用机理研究进展[J]. 激光技术, 1996, 20: 181-184
- [4] 计世番. 导弹的抗激光加固[J]. 导弹与航天运载技术, 1996, 5: 36-42
- [5] 郭亚林. 激光辐照下的材料破坏和防护研究进展[J]. 材料保护, 2003, 12: 8-10
- [6] 李雅娣, 吴平, 马喜梅, 等. 氧化锆涂层在激光防护中的应用研究[J]. 表面技术, 2008, 37(3): 71-74

(上接第65页)

度600r/min、温度50℃。

## 3 结 论

1) 在形成Cu-W复合镀层的过程中,W的质量浓度和电流密度对复合镀层中W沉积量影响显著,搅拌强度和温度的影响其次。

2) 复合电沉积Cu-W复合镀层的最优工艺如下:W的质量浓度为35g/L、电流密度为4A/dm<sup>2</sup>、搅拌强度为600r/min、温度为50℃。

### [参考文献]

- [1] 《表面处理工艺手册》编审委员会. 表面处理工艺手册[M]. 上海: 上海科技出版社, 1991. 68-76
- [2] 刘小兵, 王徐承, 陈煜, 等. 复合电沉积的最新研究动态[J]. 电化学, 2003, 2(9): 117-124
- [3] 荣命哲. 电接触理论[M]. 北京: 机械工业出版社, 2004. 1-27
- [4] 张万胜. 电触头材料国外基本情况[J]. 电工合金, 1995, (1): 1-20